反応性パルス DC スパッタリング成膜における BiFeO3系強磁性・強誘電薄膜の高品位作製の指針

武田 航太朗, 吉村 哲 (秋田大)

Guidelines for fabrication of high quality multiferroic BiFeO₃ based thin films in pulsed DC reactive sputtering method K. Takeda, and S. Yoshimura

(Akita Univ.)

はじめに 強磁性・強誘電材料は、印加電界 E による磁化 M の方向制御、印加磁場 H による電気分極 P の方 向制御が可能とされているため、革新的な次世代電子材料として注目されている。本材料を電圧駆動型の磁 気デバイスに使用する場合,高信号出力化などの観点から高い飽和磁化 M。が求められる.以前,本研究グル ープではRFスパッタリング法を使用してBi_{1-x}Ba_xFeO₃薄膜を作製していたが、その M_x の最大値はBi_{1-x}Ba_xFeO₃ 粉末の M_sの半分程度の 60 emu/cm³しか示さなかった.そこで、薄膜を高品位に作製するため、RF スパッタ リング法に代えて、反応性パルス DC(R-PDC)スパッタリング法 ¹⁾を用いて Bi_{1-x}Ba_xFeO₃系薄膜の作製を試み た. R-PDC スパッタリング法では最大 92 emu/cm³となり, M₅の大幅な向上が見られた. また, R-PDC スパ ッタリング法で作製した薄膜は、RFスパッタリング法で作製した薄膜に比べ、成膜速度は5倍程度、抵抗値 は 20 倍程度となり,他の特性に関しても大幅な向上が見られた²⁾.しかし, R-PDC スパッタリング法におけ る成膜条件として、一般的な成膜電力に加え、パルス周波数やターゲット素材なども存在し、これらと薄膜 の品質における相関は詳しくわかっていない.本研究では、R-PDCスパッタリング法で作製した薄膜の磁気 特性における,成膜電力依存,パルス周波数依存,ターゲット素材依存を明らかにすることを目的とした. <u>方法</u> R-PDC スパッタリング法を用いて,(Bi_{0.5}Ba_{0.5})FeO₃(BBFO)薄膜(膜厚 300 nm)を,熱酸化膜付き Si 基板 上に Ta(5 nm)/Pt(100 nm)の下地層を成膜した後,積層膜として作製した.積層膜は基板温度として,Ta を室 温, Pt を 300℃, BBFO を 695℃で成膜した. さらに, BBFO 薄膜のペロブスカイト構造の形成を促進させる ために、成膜時の薄膜に VHF プラズマ照射を施した. BBFO 薄膜の成膜には、Fe 粉末と Ba-Fe-O 粉末とを焼 結させて作製した,酸化物の含有量が異なる(導電特性が異なる)3種類のターゲットに,Biシートを配置 したものを用いた. R-PDC スパッタリング法におけるパルス条件として,周波数を 50~250 kHz,電力を 80 ~200Wの範囲で変化させた.作製したBBFO薄膜の組成分析は、エネルギー分散型X線分光器(EDS)によ

結果 *M*_sの成膜電力に対する変化は、Fig.1 に示すように、電力増大に伴い単調に増加し、200 W において 最大値 92 emu/cm³の高い値を示した. *M*_sのパルス周波数に対する変化は、Fig.2 に示すように、周波数減少 に伴い単調に増加した. Fig.3 には、ターゲットに含まれる酸化物含有量の割合が 14, 17, 20 mol%で、導電特 性が異なるターゲット(Ox-14, Ox-17, Ox-20)を用いて作製した薄膜の、*M*_sのターゲット中酸化物含有量依存 性を示す. 酸化物含有量が少ないほど、*M*_sは高い値を示した. 以上の結果より、成膜電力が高く、パルス周 波数が低く、ターゲットの導電性が良いほど、より大きな *M*_sを持つ強磁性・強誘電 BiFeO₃系薄膜が作製でき ることがわかった. これは、アーク放電が抑制された R-PDC スパッタリング法では、高いエネルギーを有す るスパッタ粒子を離散的に基板に到達させることで、原子の基板表面拡散を促進させるためと考えられる.

<u>参考文献</u> 1) D. Pelleymounter et al., 2014 Soc. Vac. Coat., 57th Annual Technical Conference Proceedings, Chicago, USA. 2) 吉村哲, 第 42 回日本磁気学会学術講演概要集, 13aA-5.





り、磁気測定は、振動試料型磁力計(VSM)により行った.

Fig.2 Dependence of saturation magnetization of BBFO films on pulse frequency.

g.3 Dependence of saturation magnetization of BBFO films on oxygen content in target.